



Journée « Contrôle non destructif et caractérisation de défauts »

Salon MESUREXPOVISION

Paris Porte de Versailles, Hall 1

Jeudi 25 octobre 2012

Salle bleue

Présidents de session : Jean-Luc Bodnar (Université de Reims Champagne Ardenne, Reims), Henri Walaszek (CETIM, Senlis), Jacques Bouteyre (Astrium, Bordeaux)

9h00 - 9h30 Accueil café

9h30 - 9h40 Ouverture. Michel Lannoo (Président de la SFP), Jean-Claude Mialocq (Président du Comité d'Exposition de la SFP) et Jean-Luc Bodnar (Université de Reims Champagne Ardenne)

9h40 - 10h05 Caractérisation de défauts situés dans des œuvres d'art par thermographie infrarouge stimulée. Jean Luc Bodnar (Université de Reims Champagne Ardenne)

10h05 - 10h30 Caractérisation de défauts situés dans des métaux par thermographie infrarouge stimulée. Patrick Bouteille (CETIM)

10h30 - 10h55 La simulation et l'imagerie, outils de caractérisation de défauts en CND. Clarisse Poidevin (CEA/LIST/DISC/Dir)

10h55 - 11h20 Caractérisation de défauts par imagerie ultrasonore. François Berthelot (CETIM)

11h20 - 11h45 Caractérisation de défauts par méthodes de CND. Jacques Bouteyre (Astrium)

11h45 - 12h10 Caractérisation des matériaux du bâtiment par thermographie infrarouge, Laurent Ibos (Université Paris Est)

12h10 - 14h30 Déjeuner libre et visite du salon

14h30 - 14h55 Caractérisation de défauts par tomographie X et radiographie X. Sébastien Bruchacz (CETIM)

14h55 - 15h20 Caractérisation de défauts par méthodes flux métriques. Didier Defer (Université d'Artois)

15h20 - 15h45 Caractérisation de défauts par magnétoscopie, ressuage et courants de Foucault. Henri Walaszek (CETIM)

15h45 - 16h10 Caractérisation de défauts par méthodes ultrasoniques et thermo-optiques. Eric Kuhn (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense)

16h10 - 16h35 Caractérisation de défauts par thermographie infrarouge aléatoire associée à des statistiques d'ordres supérieurs. Eric Perrin (Université de Reims Champagne Ardenne)

16h35 - 17h00 Les accélérateurs à laser-plasma au service du CND. François Sylla (ENSTA, ParisTech)

17h00 Conclusions



Comité d'organisation : Jean-Luc Bodnar (Université de Reims Champagne Ardenne, Reims) et Jean-Claude Mialocq (CEA Saclay, DSM/IRAMIS/SIS2M)

Pour plus d'informations : <http://sfp.in2p3.fr/expo/>

Journée « Contrôle non destructif et caractérisation de défauts »

Salon MESUREXPOVISION

Paris Porte de Versailles, Hall 1

Jeudi 25 octobre 2012

Salle Mesurexpovision

Formulaire d'inscription

Inscription gratuite mais obligatoire

Envoyer à secretariat@sfpnet.org ou sous enveloppe affranchie à :

**Société Française de Physique
33 rue Croulebarbe
75013 Paris**

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :

.....

Code Postal : Ville :

Pays /

Téléphone : Fax :

Courriel :